表面弾性波による GaAs 表面の誘電率変化 Permittivity modulation at GaAs surface induced by surface acoustic waves ○ 吉田 直由、飯田 成、松友 知将、坂東 弘之、松末 俊夫 (千葉大院・融合) [○]Naoyuki Yoshida, Naru Iida, Kazuyuki Matsutomo, Hiroyuki Bando, Toshio Matsusue (Chiba Univ.)

E-mail: acwa2479@chiba-u.jp

1. 序論 我々は、表面弾性波 (SAW) の光電子デバイスへの応用を目指して研究を行っている。 GaAs 表面に励振させた SAW で、時空間的な 物性制御が期待される。本研究では SAW が誘 起する表面の光学特性、特に比誘電率変化 Δε を調べた。

2. 実験 Fig. 1 に示すように、GaAs(001) 基板 上の櫛型電極 (IDT) に RF 電気信号を印加して SAW を励振した。GaAs 表面に集光したレー ザー光 (集光径 $d \simeq 2 \mu m, d/\lambda_{SAW} \simeq 1/15$) を照 射し、その反射光を励振周波数 ($f = \omega_{SAW}/2\pi$) でロックイン検出した。反射光強度 I の SAW 誘起成分は

 $\Delta I(t) = \Delta I_{0X} \sin(\omega_{SAW}t) + \Delta I_{0Y} \cos(\omega_{SAW}t)$ (1) のように表され、2 位相成分 ($\Delta I_{0X}, \Delta I_{0Y}$) が検出 される。 $\Delta I_0/I$ から、比誘電率変化 ($\Delta \varepsilon_X, \Delta \varepsilon_Y$) を評価した。

3. 結果と考察 表面変位は進行波 SAW の場合

 $u_z(x,t) = \delta_0 cos\{k_{\text{SAW}}x - \omega_{\text{SAW}}(t-t_0)\}$

$$= \delta_0 [-\sin(k_{\text{SAW}}x)\sin\{\omega_{\text{SAW}}(t-t_0)\}$$

$$+\cos(k_{\text{SAW}}x)\cos\{\omega_{\text{SAW}}(t-t_0)\}] \qquad (2)$$



Fig. 1: Schematic of experimental set up



と表され、定在波 SAW の場合

$u_z(x,t) = -\delta_0 \cos(k_{\text{SAW}}x) \sin\{\omega_{\text{SAW}}(t-t_0)\}$

+ $\delta_0 \cos(k_{SAW}x) \cos\{\omega_{SAW}(t-t_0)\}$ (3) と表される。これに対応して歪みも変化する ので、Eq. (1) と (ΔI_{0X} , ΔI_{0Y})から、SAW の伝 搬状態がわかる。Fig. 2 に ΔI_0 の位置依存性 の結果を示す。右軸は $\Delta I_0/I$ から求めた $\Delta \varepsilon$ を 表す。自由伝搬領域 (*a*) では進行波的であり、 IDT 中央部 (*b*) では IDT 電極指間の中心で節を 持つ定在波的である。領域 (*a*) において回折光 測定 [1] で評価した δ_0 から、SAW 波動方程式 [2] を基に歪みテンソルを見積もり、 $\Delta \varepsilon$ の偏光 依存性 (Fig. 3) を用いて光弾性定数を評価する と、 p_{11} + 1.9 p_{12} = -300, p_{44} = -15 となる。 λ_{Light} = 1.15 μ m でバルク波の回折効率から求 めた値 [3] に比べて 2 桁大きいが、その理由は 検討中である。

4. 結論 SAW 誘起誘電率の時空間変化を評価 し、SAW の伝搬状態と対応させて検討した。 SAW 励振による GaAs 基板表面での光弾性定 数を見積もると、比較的大きな値をもつことが わかった。



Fig. 2: Permittivity modulation induced by SAW. Gray zone indicates surface area covered by Al film of electrode fingers in IDT.

Fig. 3: An anisotropy of permittivity modulation

[1] W. S. Goruk, IEEE Trans. on Sonics and Ultrasonics, SU-27, 341 (1980).

[2] S. H. Simon, Phys. Rev. B58, 19 15 (1996). [3] R. W. Dixon, J. Appl. Phys. 38, 5149 (1967).